

## ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ СЛАБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ В МАГНЕТСОПРОТИВЛЕНИИ СИЛЬНО АНИЗОТРОПНОЙ ДВУМЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Э.П.Нахмедов, В.Н.Пригодин, Ю.А.Фирсов

Вычислено поперечное и продольное магнетосопротивление, обусловленное локализационными эффектами, в системе слабо взаимодействующих толстых металлических нитей, расположенных в плоскости. Открытый характер поверхности Ферми приводит к тому, что спектр диффузионной моды в канале электрон-электрон описывается уравнением Матье. Настоящая модель могла бы быть применимой для описания кинетических явлений в дислокационном слое на границе спайности бикристаллов с малыми углами сращивания.

В последнее время в связи с изучением двумерной локализации интенсивно начинают исследоваться высокопроводящие слои, реализующиеся в плоскости сращивания бикристаллов германия<sup>1, 2</sup>. Соответствующая модель, описывающая локализацию при  $T = 0$ , частично была исследована в предыдущих работах авторов<sup>3, 4</sup>. Было предложено рассматривать такой слой, как квазиодномерную систему на плоскости, где в качестве одномерных металлических нитей выступают краевые дислокации<sup>5</sup>. Их размер оказывается порядка  $\rho = 30 \div 40 \text{ \AA}$  и среднее расстояние между ними  $d = b / 2 \sin \frac{\theta}{2}$ , где  $b \approx 5 \text{ \AA}$  и  $\theta$  – угол сращивания. Электронное заполнение в слое определяется потенциалом как оборванных связей, так и экранирующим потенциалом дырок. При малых углах сращивания можно представить ситуацию, что  $w_{\perp} \ll \epsilon_F \lesssim w_{\parallel}$ , где  $w_{\parallel}$  и  $w_{\perp}$  – резонансные интегралы вдоль и поперек дислокационных трубок, причем  $w_{\perp} \approx w_{\parallel} \exp\left(-\frac{d}{\rho}\right)$ . Тогда поверхность Ферми в отличие от чисто двумерного случая, где  $w_{\perp} \approx w_{\parallel}$ , оказывается открытой ( $\epsilon - \epsilon_F = v_F(|p_{\parallel}| - p_F) - w_{\perp} \cos p_{\perp} d$ ), и далее

физическая ситуация зависит от соотношения между амплитудой гофрировки поверхностей и их примесным размытием, т. е. безразмерного параметра  $w_{\perp}\tau$ , где  $\tau$  — больцмановское время рассеяния на примесях,  $\epsilon_F\tau \gg 1$ . При  $w_{\perp}\tau \gg 1$  мы фактически имеем дело с двумерной хотя и очень анизотропной локализацией. Однако, получающаяся при этом параметрическая зависимость, например, длины локализации отличается от таковой для анизотропной системы с замкнутой поверхностью Ферми<sup>3, 4</sup>. В другом пределе,  $w_{\perp}\tau \ll 1$ , локализация носит одномерный характер.

На явление слабой локализации разрушающее действие оказывает магнитное поле. Изучение магнитосопротивления в различных системах и геометриях поля на уровне первых поправок было начато в работах<sup>6, 7</sup>. В настоящее время этому вопросу посвящено большое число работ, однако во всех них поверхности Ферми предполагаются закрытыми, и поэтому зависимость типа  $\ln(H/H_0)$  в двумерном случае получается всегда. Ниже будет показано, что в случае открытой поверхности Ферми ответ получается иной. Первая локализационная поправка к проводимости происходит от диффузионной моды в канале электрон-электрон и может быть представлена в виде

$$\sigma_j = \sigma_j^0 \left(1 - \frac{1}{N} Z\right); \quad \sigma_{\parallel}^0 = e^2 \frac{2lN}{\pi d}; \quad \sigma_{\perp}^0 = e^2 (w\tau)^2 N \frac{d}{l}, \quad (1)$$

$$Z = \frac{v_F d}{V} \sum_n \frac{1}{\Omega + \epsilon_n}, \quad (2)$$

где  $N = Sp_F^2$  и  $S$  — сечение нити, причем полагается, что  $N \ll \epsilon_F/w$  (здесь и далее значок  $\perp$  при  $w$  мы опускаем), а  $V$  — "объем" системы,  $V = L_{\perp}L_{\parallel}$ . В (2)  $\Omega(T) = \frac{1}{\tau_{in}} < \frac{1}{\tau}$  — частота неупругих столкновений, а  $\epsilon_n$  — спектр указанной моды. Последний в присутствии магнитного поля следует находить из уравнения:

$$\left[ -D_{\parallel} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + D_{\perp} \left(1 - \cos\left(d \left(\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} - \frac{2eH}{c} x\right)\right)\right) \right] \Psi_n = \epsilon_n \Psi_n, \quad (3)$$

где  $D_{\parallel} = v_F l$  и  $D_{\perp} = w^2 \tau$  — продольный (ось  $x$ ) и поперечный коэффициенты диффузии,  $l = v_F \tau$ . Уравнение (3) можно вывести, используя конкретные результаты для диффузонов при  $H = 0$ <sup>8</sup> и рассматривая поле  $H$  в квазиклассическом приближении стандартным образом, принятом в теории сверхпроводимости<sup>9</sup>. Если подбжить  $\Psi(x, y) = e^{iqy} u(x)$ , то (3) переходит в известное уравнение Матве:

$$\left[ -D_{\parallel} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + D_{\perp} \left(1 - \cos\left(q_{\perp} d - \frac{2dx}{l_H^2}\right)\right) \right] u = \epsilon u, \quad (4)$$

где введена магнитная длина  $l_H^2 = e/Hc$  и допустимые поля ограничены условием  $l_H \gg \sqrt{s}$ . Отличие (4) от обычного уравнения для осциллятора обусловлено именно наличием открытой поверхности Ферми. Уравнениям (2) и (4) после обезразмеривания можно придать вид

$$Z = 2N_m \int \frac{dE}{\pi} \rho(E) \frac{1}{E + N_m^2 \Omega \tau}, \quad (5)$$

где  $N_m = l_H^2/dl$  и  $\rho(E)$  — спектральная плотность состояний уравнения

$$\left[ 4 \frac{\partial^2}{\partial t^2} + E + J(\cos t - 1) \right] u = 0, \quad (6)$$

где  $J = (w\tau N_m)^2$ . Пусть  $w\tau \ll 1$ , тогда существенным параметром задачи будет  $J$ . В пределе  $J \rightarrow 0$  (этот случай отвечает сильным полям  $N_m < 1/w\tau$  и допускает переход к независимым нитям,  $w = 0$ ) спектр (6) имеет вид  $E = 4q^2$  и  $\rho(E) = 1/4\sqrt{E}$ . Учет слабого

возмущения по  $J$  приводит к сдвигу начала спектра  $E = 4q^2 + J - \frac{1}{2}J^2 + o(J^3)$  и появлению запрещенных зон при значениях  $E_n = n^2$  с шириной порядка  $\Delta E_n \approx J^{n^{-10}}$ . Пренебрегая последним эффектом, найдем

$$Z(H, T) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\Omega\tau + (w\tau)^2}} \left( 1 + \frac{(w\tau)^2}{\Omega\tau + (w\tau)^2} \left( \frac{l_H^2 w\tau}{2dl} \right)^2 + o(J^2) \right), \quad (7)$$

т. е. магнетосопротивление в полях  $l_H^2 < d \frac{v_F}{w}$  достигает насыщения.

В области  $J \gg 1$  и  $E < J$  (6) переходит в уравнение для осциллятора

$$\left[ 4 \frac{\partial^2}{\partial t^2} + E - \frac{J}{2} t^2 \right] u = 0. \quad (8)$$

В этом случае спектр состоит из дискретных сильно вырожденных уровней и  $\rho(E) = \frac{1}{2} \delta(E - E_n)$ , где  $E_n = \left( n + \frac{1}{2} \right) \sqrt{8J}$ . Учет туннелирования между вырожденными состояниями в (8) приводит к слабому харперовскому уширению уровней ( $\sim \exp(-(J - E))$ ) по сравнению с расстоянием между ними, и поэтому его можно опустить пока  $E_n < J$  или  $n < N_c$ ,  $N_c \approx \sqrt{\frac{J}{8}} = \frac{l_H^2 w}{\sqrt{8} dv_F}$ . Для  $E > J$  ситуация меняется на противоположную.

Здесь имеются широкие разрешенные и узкие запрещенные зоны, снова можно приближенно считать спектр непрерывным с  $\rho(E) = 1/4\sqrt{E}$ . В результате найдем

$$Z(H, T) = \frac{1}{\sqrt{8\pi w\tau}} \ln \frac{\Omega\tau + (w\tau)^2}{\Omega\tau + 2(w\tau)^2/\sqrt{2J}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\Omega\tau + (w\tau)^2}}. \quad (9)$$

Отсюда следует, что перпендикулярное к слою магнитное поле  $l_H^2 dv_F/w$  имеет заметный эффект, если  $\Omega(T) \ll w^2\tau$ . Тогда

$$Z(0, T) - Z(H, T) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi w\tau}} \ln \left( 1 + \sqrt{2} \frac{w}{\Omega} \frac{ld}{l_H^2} \right). \quad (10)$$

В области температур, где  $w^2\tau \ll \Omega(T)$ , изменение  $Z$  как функции  $H$  не превышает значения

$$\Delta Z \approx \frac{3}{16} \frac{(w\tau)^2}{(\Omega T)^{5/2}}. \quad (11)$$

В случае  $1 \ll w\tau \ll \epsilon_F\tau$  расчет первой поправки проводится непосредственно, и результат может быть записан в виде

$$Z(H, T) = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{l_{\perp}} \ln \left( 1 + 1/\left( \Omega\tau + \frac{l^2}{l_H^2} \right) \right), \quad (12)$$

где  $l^2 = l_{\parallel} l_{\perp}$  и  $l_{\perp}^2 = (w d \tau)^2 / 2 \ll l_{\parallel}^2 = (v_F \tau)^2$ , что уже похоже на обычный двумерный ответ. Таким образом при  $\tau w \approx 1$  имеет место явление кроссинга от одномерного поведения к трехмерному.

Наконец мы должны учесть эффект магнитного поля в пределах отдельных нитей<sup>7</sup>. Это можно выполнить путем замены в настоящих формулах  $\Omega\tau \rightarrow \Omega\tau + b \frac{l^2 S}{l_H^4}$ , где  $b$  — число

порядка единицы. Магнетосопротивление для поля, направленного параллельно слою, целиком обусловлено подобным эффектом, и поэтому

$$Z(H, T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi w\tau}} \ln \left( 1 + \frac{w\tau}{\left( 2\Omega\tau + b \frac{l^2 S}{l_H^4} \right)^{1/2}} \right), \quad (13)$$

$$Z(H, T) = \frac{1}{4\pi} \frac{d}{l_{\perp}} \ln(\max(\Omega\tau, l_{\parallel}^2 S/l^4)) , \quad (14)$$

где (13) написана для  $w\tau \lesssim 1$  и (14) —  $w\tau \gtrsim 1$ . Выше мы ограничились рассмотрением лишь первой локализационной поправки, поэтому применимость результатов ограничена условием, что  $Z/N$  остается малым. При этом следует иметь в виду, что в настоящем случае стандартный параметр малости  $1/\epsilon_F\tau \ll 1$  заменяется на  $1/Nw\tau$  или  $d/Nl_{\perp}$ , и поэтому эта поправка гораздо больше, чем обычно. Экспериментальная ситуация в бикристаллах<sup>1, 2</sup> говорит, что важен учет  $e$ - $e$  взаимодействия. Влияние его было учтено нами на примере поправки к плотности состояний<sup>11</sup>. Роль  $e$ - $e$  взаимодействия в магнетосопротивлении таких систем нуждается в дополнительном исследовании.

Итак мы видели, что открытость поверхностей Ферми заметно влияет на все результаты, особенно, если амплитуда гофрировки мала по сравнению с примесным рассеянием,  $w\tau < 1$ . Для реализации такой ситуации на эксперименте следует брать бикристаллы не с очень большим углом срачивания  $\theta < 7 \div 10^\circ$ , когда  $d > 40 \text{ \AA}$ .

#### Литература

1. Landwerh P.H. Phys. Stat. Sol., 1963, 3, 440; Landwerh P.H., Uchida S. In "Localization and Metal-Insulator Transition" ed. by H.Fritzche and D.Adler, p. 374, 1985.
2. Вул В.М., Заварицкая Е.И. ЖЭТФ, 1979, 76, 1089; Письма в ЖЭТФ, 1983, 39, 576.
3. Firsov Yu. A., Prigodin V.N. Sol. St. Comm., 1985, 56, 1069.
4. Firsov Yu. A. In "Localization and Metal-Insulator Transition" ed by H.Fritzche and D.Adler, p. 477, 1985.
5. Mataré H. Defect Electronics in Semiconductors, N.Y., 1971.
6. Altshuler B.L., Khmel'nitzkii D.E., Larkin A.I., Lee P.A. Phys. Rev., 1980, B22, 5142; Altshuler B.L., Aronov A.G., Khel'nitzkii D.E. Sol. St. Comm., 1981, 39, 619.
7. Альтшулер Б.Л., Аронов В.Г. Письма в ЖЭТФ, 1981, 33, 515.
8. Firsov Yu.A., Prigodin V.N. In "Localization in Disordered System", ed. by W.Weller and P. Ziesche, Leipzig, Teusner-Texte zur Physik, band 3, p. 194, 1984.
9. Горьков Л.П. ЖЭТФ, 1959, 36, 1918.
10. Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике, М.: Мир, 1972.
11. Firsov Yu.A., Nakhmedov E.P., Prigodin V.N., Weller W. Phys. Stat. Sol., b, in press, 1986.